

性能及测试方法

■性能及测试方法

项目		性能	性能及测试方法及条件 (根据JIS C 5101-1)						
		X5R 特性							
静电容量		允许差以内	CLASS 2 <table border="1"> <tr> <td>标称静电容量</td> <td>测定频率</td> <td>测定电压</td> </tr> <tr> <td>$C \leq 10\mu\text{F}$</td> <td>$1\text{kHz} \pm 10\%$</td> <td>$1.0 \pm 0.2\text{Vrms}$</td> </tr> </table> 测量前进行热处理	标称静电容量	测定频率	测定电压	$C \leq 10\mu\text{F}$	$1\text{kHz} \pm 10\%$	$1.0 \pm 0.2\text{Vrms}$
标称静电容量	测定频率	测定电压							
$C \leq 10\mu\text{F}$	$1\text{kHz} \pm 10\%$	$1.0 \pm 0.2\text{Vrms}$							
介电损耗因数		10%以下							
耐电压		无绝缘击穿, 无破损	施加电压 : 1~5秒間 在硅油中施加电压(W. V. 630V以上) 充放电电流 : 50mA以下 施加电压 : 额定电压×250%						
绝缘阻抗		10,000MΩ或500MΩ·μF任意小的一方值以上	施加电压 : 额定电压 施加时间 : 1分钟						
粘附强度	引线接合	0.03N以上	用Φ25μ的Au线进行引线接合贴装后, 再测量引线的强度						
温度循环	外观	无明显机械损伤	常温→最低使用温度→常温→最高使用温度 3分钟 → 30分钟 → 3分钟 → 30分钟 依次将电容置于上述1~4个阶段中为一个循环 此操作进行五个循环						
	静电容量变化率	±7.5%以下							
	Q及介电损耗因数	满足初始值							
	绝缘阻抗	满足初始值							
耐湿负荷	外观	无明显机械损伤	进行电压处理 测试温度: 40±2℃ 相对湿度: 90~95%RH 测试电压: 额定电压 测试时间: 500時間						
	静电容量变化率	±12.5%以下							
	Q及介电损耗因数	初始值的2倍以下							
	绝缘阻抗	10MΩ以上							
高温负荷	外观	无明显机械损伤	进行电压处理 测试温度: 85±3℃ 相对湿度: 额定电压×150%的直流电压 测试时间: 1000小时 测试条件, 根据品种不同. 详情请确认个别工艺书.						
	静电容量变化率	±12.5%以下							
	Q及介电损耗因数	初始值的2倍以下							
	绝缘阻抗	10MΩ以上							

注1: 品种不同性能规格会有差异。详情请确认个别的规格书。

注2: 热处理需要在150+0/-10℃、1小时后, 从室温中取出, 放置48±4个小时。

注3: 电压处理要在规定的试验条件下进行, 1小时处理后, 从室温中取出放置48±4个小时。